



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.Ф. ИОФФЕ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ПРИКАЗ

От 24.10.2017 № 94А

г. С.-Петербург

[Об утверждении перечня оборудования ЦКП]

С целью повышения эффективности использования дорогостоящего и уникального научного оборудования Института для оказания услуг внутренним и внешним пользователям при обеспечении Федеральным Центром коллективного пользования научным оборудованием «Материаловедение и диагностика в передовых технологиях» (базовая организация – ФТИ им. А.Ф. Иоффе) инфраструктурной поддержки фундаментальных и поисковых научных исследований,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить новую редакцию Перечня оборудования ФЦКП (Приложение № 1 к приказу).

и.о. Директора Института

С.В. Лебедев

Перечень оборудования
ФЦКП «Материаловедение и диагностика в передовых технологиях»

	Наименование	Страна	фирма-изготовитель	марка	год
1	Микроскоп стереоскопический с системой цифровой регистрации Eclipse L150	Япония	Nikon	Eclipse L150	2009
2	Установка для электронной литографии на базе растрового электронного микроскопа JSM-7001F	Япония	JEOL (Japanese Electron Optics Laboratory, Джеол)	JSM-7001F	2016
3	Специализированный высоковакуумный стенд STE IBS (НиТО)	Россия	ЗАО «Научное и технологическое оборудование»	STE IBS	2015
4	Порошковый рентгеновский дифрактометр Bruker D2 Phaser	Германия	Bruker ASX	D2 Phaser	2015
5	Микроскоп стереоскопический с системой цифровой регистрации SMZ 745T (Nikon)	Япония	Nikon	SMZ 745T	2013
6	Система ионного утонения образцов Nanomill 1050 (Fischione Instruments)	Соединённые Штаты Америки	Fischione Instruments	Nanomill 1050	2013
7	Сферический токамак Глобус-М	Россия	ФТИ им. А.Ф. Иоффе	Глобус-М	2016
8	Универсальный вторично-ионный микроанализатор Ion Microanalyzer IMS-7F в расширенной комплектации с комплектом дополнительного специального научного и инженерного оборудования обеспечивающего его работоспособность и	Франция	Cameca	IMS-7F	2011

	с комплектом ЗиП (Самеса)				
9	Высокоразрешающий рентгеновский дифрактометр с вращающимся анодом D8 Discover	Германия	Bruker ASX	D8 Discover	2006
10	Установка для исследования температурной зависимости электрофизических и оптических параметров твердотельных наногетероструктур	Россия	Разработка и изготовление ФТИ им. А.Ф. Иоффе	НГУ-СПП	2016
11	Комплекс для локального анализа поверхности с помощью сканирующей зондовой микроскопии в условиях контролируемой инертной атмосферы	Россия	Разработка и изготовление ФТИ им. А.Ф. Иоффе	Veeco Dimension 3100	2016
12	Комплекс для локального анализа структуры, атомного состава и связей с помощью просвечивающей электронной микроскопии на базе JEM-2100F	Япония	JEOL (Japanese Electron Optics Laboratory, Джеол)	JEM-2100F	2016